

Qualitätssicherung: Sibress präsentiert neues Mikroskop SibScope

Starnberg (D), 05. Mai 2015 – Sibress, Hersteller von Mess- und Analysesystemen zur Qualitätssicherung im Flexo- und Verpackungsdruck aus Starnberg bei München, bringt das neu entwickelte Mikroskop SibScope und die Messsoftware SibView auf den Markt.

Das von Sibress neu entwickelte Mikroskop SibScope dient der Aufgabe, mit höchster Bildqualität und -präzision Objekte, wie z. B. Anilox, Gravur und Flexoplatten, zu untersuchen. Bei maximaler Vergrößerung werden Objekte mit einer Größe von 97 µm mit der 80x-Optik bildschirmfüllend dargestellt (bezogen auf 60 cm Bildschirmdiagonale). SibScope lässt sich sowohl auf runden bzw. zylindrischen Oberflächen (ab 6 cm Durchmesser) als auch auf planen Flächen einsetzen.

Höchste Detailschärfe dank Filtertechnologie

Das Mikroskop ist mit fünf planachromatischen Optiken (Planfeld-Objektiven) ausgestattet. Die gewünschte Vergrößerung wird einfach durch Drehen des Objektivrevolvers gewählt. SibScope wird mit folgenden Optiken ausgeliefert: 5x, 10x, 20x, 40x, 80x sowie optional 4x und 100x. Eine Vielzahl verfügbarer mechanischer Filter ermöglicht es, Oberflächen detailscharf und kontrastreich darzustellen.

Zur Objektbetrachtung kann der Anwender zwischen dem mitgelieferten 10-fach Binokular und der eingebauten, hochauflösenden Mikroskopkamera umschalten. Das Bild lässt sich dann an einem PC-Monitor begutachten. Die Mikroskopoptik ist in X-, Y- und Z-Richtung (Höheneinstellung) verfahrbar. Zur Höhen/Tiefen-Ermittlung ist in SibScope eine Digitalmessuhr mit einer Auflösung von 1 µm integriert. Die manuelle Höhenverstellung lässt Genauigkeiten von deutlich unter 1 µm zu, sodass auch feinste Oberflächenstrukturen fokussiert und damit gestochen scharf begutachtet werden können.

Bei einer Messung werden die Höhenmesswerte sofort über das speziell für das Mikroskop konzipierte Interface in die mitgelieferte, von Sibress ebenfalls neu

entwickelte Software SibView übertragen. SibView zeigt auch vollautomatisch die jeweils gewählte planachromatische Optik an. Somit werden für jede Optik die in der Software hinterlegten Kalibrationsparameter automatisch angewählt und Messungen korrekt angezeigt.

SibView – mehr als ein Messwerkzeug

Das System wird in X-, Y- und Z-Achse kalibriert geliefert. Die SibView Software bietet diverse Messwerkzeuge, wie Abstandsmessung, Winkellage, Winkellagen-Vergleich, Breiten-Abstandsmessung mit Winkellage, Kreis, Umfang und Fläche. Dem Bild können zusätzliche Kommentare zugefügt werden.

Bei Aufnahmen mit Höhenmessung werden Bild und Höhenmesswerte zusammen abgespeichert und können auch wieder als solche geladen werden. Eine speziell entwickelte Bild-Schnellspeicherfunktion erlaubt dem Anwender, das Bild mit entsprechender Tiefen-/Höheninformation durch einen beliebigen Tastendruck im Bruchteil einer Sekunde zu speichern. Bild und Höhen/Tiefen-Informationen werden in einem frei wählbaren Ordner abgespeichert, ohne dass dem Bild ein spezieller Name zugewiesen werden muss. Auf dieser Basis lassen sich die Aufnahmen in einer Drittsoftware zu einem 3D-Bild zusammenrechnen.

SibScope – mehr als ein Mikroskop zur Oberflächenbegutachtung

Das Mikroskop SibScope lässt sich auch mit der von Sibress optional gelieferten Versatile@Flex Software zur Auswertung von Flexodruckplatten nutzen. Die seit Jahren im Markt etablierte Flexo-Software analysiert vollautomatisch Parameter wie Rasterprozentwert, Rasterpunktgröße, Rasterweite und vieles mehr. Gleichzeitig lässt sich auch die exakte Relieftiefe von Flexoplatten ermitteln. Rasterpunkte können endlich in höchster Auflösung begutachtet und dabei real gesehen werden. Dies ist speziell für HD-Flexoanwendungen von großem Interesse. Die genaue Höhendifferenz zwischen einzelnen Rasterpunkten lässt sich ebenso ermitteln wie der effektive Umfang eines Punkts an jeder Stelle.

Die Kombination beider Softwarepakete macht SibScope auch zu einer idealen Lösung für Flexodruckbetriebe mit eigener Repro, die sowohl ihre Aniloxwalzen als auch ihre Flexoplatten analysieren wollen.

Darüber hinaus eignet sich SibScope durch seine optischen Filter auch hervorragend für Gravurbetriebe oder zur Untersuchung von gedruckten Leiterplattenstrukturen. Es findet

überall dort Einsatz, wo es darauf ankommt, kleinste Details durch hervorragende Bildauflösung und -schärfe zu begutachten und zu bewerten.

Weitere Informationen über das Produktprogramm von Sibress gibt es unter www.sibress.com.

Herausgegeben von PR KOM im Auftrag von

Sibress

Karwendelstraße 24

82319 Starnberg

Deutschland

Ansprechpartner: Michael Romanowski

Tel. +49 (0)8151 550 85 22

E-Mail: info@sibress.com

www.sibress.com